

第 16 回表面科学基礎講座 —表面・界面分析の基礎と応用—

小蒲 哲夫・越川 孝範*

三菱電機(株)材料デバイス研究所

〒661 尼崎市塚口本町 8-1-1

* 大阪電機通信大学応用電子工学科

〒572 寝屋川市初町 18-8

(1994年1月10日受理)

The 16th Surface Science Lecture Course

Tetsuo OGAMA and Takanori KOSHIKAWA*

Materials & Electronic Devices Lab., Mitsubishi
Electric Corp., 8-1-1, Tsukaguchi-honmachi,
Amagasaki, Hyogo 661

* Dept. of Applied Electronics, Osaka Electro-
Communication University, 18-8, Hatsu-cho,
Neyagawa, Osaka 572

(Received January 10, 1994)

関西地区でも秋季に表面科学基礎講座を開催するようになって3年目の平成5年度は、昨年同様「表面・界面分析の基礎と応用」と題して、11月18日と19日の2日間、大阪の三田出版会の会場で開催された。前回春に東京で開催された基礎講座と同様、昨今の経済事情から、当初は参加者の大幅な減少が危惧された。しかしながら企画委員会および関西支部の関係各位のご尽力もあり、結局77名の受講者があった。

これまでの基礎講座の受講者のアンケート結果も参考

にしつつ、内容的にはこれまで同様に、表面分析の基礎をじっくり勉強できるものを狙った。今回の具体的な講義内容は下表に示したとおりである。2日間でこれだけの内容を実施するため、多少時間的に苦しいかもしれないという懸念はあったが、講師の方々の配慮により、各講義とも時間内に基礎から一部最近の応用例までをカバーした充実したものとなった。また、今回から各講義の間ごとに10分間の休憩を入れるようにしたので、受講者はこれまでより聞きやすくなったと思われる。

今回は昨春の東京開催で取り入れた、質問票の配布とそれに対する講師の応答を両日とも実施した。直前に質問票を回収したため、質問の集計や答えを準備するのに時間が十分ではなく、事務局も講師の方々も多少大変であったが、多くの質問が寄せられ、有意義な時間が持てた。

さて、今回のアンケート集計結果から見ると、参加の動機として基礎を勉強し直したいという受講生が最も多く、例年同様な内容で継続しているこの種の基礎講座の狙いが妥当であることが改めて判明した。基礎講座の開催頻度や開催時期、日数に関しても現状に満足する声が多かった。ただ、今後基礎講座で取り上げてほしい分析技術(X線回折など)や取り組んでほしいもの(材料別の講座など)の希望も一部あった。これらのアンケート結果や希望は、当基礎講座の一層の改善のため、今後企画委員会で検討されることになろう。

なお今年春季の基礎講座は、6月8日から3日間東京の総評会館で開催されることになったので、これにも多数の方々のご参加をお願いしたい。

最後に、本講座の企画運営にご協力いただいた企画委員会、事務局、関西支部始め関係者の方々に紙面を借りて深く感謝いたします。

第 16 回表面科学基礎講座プログラム (1993年11月18~19日、於三田出版会)

1. 表面・界面分析概論	福田 安生 (静大電子研)
2. FT-IR, ラマン分光	石田 英之 (東レリサーチセンタ)
3. 電子顕微鏡 (TEM, SEM)	遠藤 久満 (京大工織大)
4. 走査プローブ顕微鏡 (STM/AFM)	八百 隆文 (広大理)
5. 電子線マイクロアナライザ (EPMA)	奥村 豊彦 (日本電子)
6. 討論	(福田, 石田, 遠藤, 八百, 奥村)
7. 電子分光装置の基礎	大岩 烈 (アルバック・フェイ)
8. オージェ電子分光法 (AES)	大村 卓一 (松下テクノロジー)
9. X線光電子分光法 (XPS)	添田 房美 (東レリサーチセンタ)
10. ラザフォード後方散乱 (RBS)	草尾 健司 (松下テクノロジー)
11. 二次イオン質量分析法 (SIMS)	工藤 正博 (成蹊大)
12. 討論	(大岩, 大村, 添田, 草尾, 工藤)